

SP-SWI/SP-DWI 光学静态/动态表面轮廓测量仪- 动态/静态形貌量测+共振频率侦测

产品名称	SP-SWI/SP-DWI 光学静态/动态表面轮廓测量仪- 动态/静态形貌量测+共振频率侦测
公司名称	北京乔泽科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区光华路7号16楼B1610室
联系电话	86-10-65610249 15652311979

产品详情

产品优势及特点：

SP-SWI/SP-DWI 光学静态/动态表面轮廓测量仪可以快速地进行纳米级3D轮廓测量、谐振频率检测，并对检测对象表面的粗糙度、平整度、厚度、台阶高度进行分析：

-快速静态分析

SP-DWI/SWI 提供友好的用户界面、非接触式、快速、纳米级jingque的 3D 轮廓测量。它适合分析任何反射率至少为 1% 的材料表面。可以进行粗糙度和台阶高度分析。

-动态测量

利用高频频闪 (>1MHz)，SP-DWI可以测量MEMS的动态特性，例如振动模式和周期性振动运动的表面轮廓。